## ミュオンスピン緩和スペクトル法の応用研究部会

## Application of muon spin relaxation spectroscopy

西村 克彦\*·櫻井 健夫\*\*·松崎 禎市郎\*\*\*·松田 健二\* Katsuhiko NISHIMURA\*, Takeo SAKURAI\*\*, Teiichiro MATSUZAKI\*\*\* and Kenji MATSUDA\*

6000系Al-Mg-Si合金は適度な強度と優れた成形性を有す るために、より広範な利用が検討されている。この合金の 機械的特性は,溶質元素の濃度と溶体化処理後の熱処理方法 に大きく依存することは古くから指摘され、とくに室温時効 の影響については各種の実験が行われてきた<sup>1),2)</sup>。溶体化処 理により導入された原子空孔(v)が関与して溶質原子--vあ るいはMg-Si-vクラスタが生成され、その後の時効により G.P. ゾーン, 中間相を経て, 安定な析出相へ変化していくと 考えられている。よって溶体化処理直後の原子空孔挙動を解 明することが、この合金の特性を向上させるために大変重要 であると認識されている。この部会は近年その検出精度が非 常に向上したミュオンスピン緩和(以後µSR)法を用いて、 アルミニウム合金中の原子空孔の挙動を捕えようとするもの で、他のいかなる材料系の学協会に先駆けて立ち上げられ た。

ミュオン(ここでは正電荷を持った正ミュオン(µ<sup>+</sup>)を指 す)は、陽子を炭素のターゲットに衝突させて発生したパイ オン (ここではπ<sup>+</sup>) がさらに崩壊することによって発生し, 半減期2.2µ秒を持つため、陽電子の0.2n秒に比較して長時 間にわたり物質中で拡散・捕獲・再拡散の過程を経ながら, 最終的に陽電子とニュートリノに崩壊する。実験で利用した ミュオンは100%スピン偏極しており、入射されるビーム方 向に対して逆方向を向いている。µ<sup>+</sup>のパルスビームが陽電

ond syncrotron

図1 ラザフォード・アップルトン研究所 (RIKEN-RAL) の鳥瞰写真

子検出器にセットされた試料に放射され、そして測定が始ま る。崩壊する際に放出される陽電子を試料の前方と後方に置 かれた検出器で検出するのだが。u<sup>+</sup>が物質中で何も影響を 受けなければスピン方向とほぼ同じ方向にほぼ100%の陽電 子が検出されることになり、いわゆる異方性は観測されな い。しかし、例えば試料中でトラップされるサイトや、拡散 している位置などの影響を受けると角度異方性を持つことに なる。よって試料中から放射される陽電子の角度異方性を観 測すると、ミュオンと試料中の元素および原子空孔との相互 作用に関する知見が得られるとされる<sup>3)</sup>。現在,本測定は連 合王国にある理化学研究所の管理するオックスフォード郊外 のラザフォード・アップルトン研究所 (RIKEN-RAL) 内に ある ISIS サイクロトロンのビームライン (Port-4) を使用し ている (図1)。

この研究部会では、昨年度中頃発足し、今年度の前半まで は、ミュオンスピン緩和法そのものの基本原理の理解と、一 部先行して取得したデータについて,参加部会員相互の理

表1 研究部会員

富山大学

理化学研究所

理化学研究所 京都大学

東京工業大学

茨城大学 横浜国立大学

富山大学

富山大学

富山大学

(株)UACJ

(株)UACJ

(株)神戸製鋼所 三協立山(株)

YKK AP(株)

アイシン軽金属(株)

大学・公立機関

所 属

氏 名

松田 健二

友野 大

里

廣澤

西村

布村

柴柳 敏哉

浅野 峰生

高木 英俊

谷畑 弘之

吉田 朋夫

蔵本 遼 櫻井 健夫

松崎 禎市郎 渡邊 功雄

達雄 伊藤 吾朗

涉一

克彦

紀男

*富山大学大学院理工学研究部(〒930-8555	富山県富山市五福3190)。	Graduate School of Science and Engineering for Education (3190
Gofuku, Toyama-shi, Toyama 930–8555).		

企業

\*\*株式会社神戸製鋼所(東京都)。Kobe Steel, Ltd. (Shinagawa-ku, Tokyo).

\*\*\*理化学研究所 仁科加速器センター (和光市)。RIKEN, The Nishina Center for Accelerator-Based Science (Wako-shi, Saitama). 受付日:平成26年7月1日



解と解釈に努めている。現在部会員は16名(表1)で,参画 企業は50音順にアイシン軽金属㈱、㈱神戸製鋼所,三協立 山㈱,㈱UACJ,YKKAP㈱である。さらに多くの企業のご 参加をお待ちしています。

図2は, 焼なまししたアルミニウム(純度99.99%)と 848Kで1時間の溶体化処理後に2週間室温時効したAL



図2 (a) 焼なまししたアルミニウムと(b) 溶体化処理後に2週間室温時効した Al-1.6% Mg<sub>2</sub>Si合金で測定された40K ミュオンスピン緩和スペクトル

1.6%Mg<sub>2</sub>Si合金のミュオンスピン緩和スペクトルである。縦 軸は陽電子計数の異方性,横軸はミュオンパルスを試料に 打ち込んでからの経過時間である。(a)のアルミニウムで は、測定時間に対して、ミュオンスピンがほとんど緩和し ておらず、ミュオンがほとんど捕獲されていない、つまり、 ミュオンを捕獲する原子空孔がほとんどないと推測される。 これに対して、(b)の溶体化処理後に2週間室温時効した Al-1.6%Mg<sub>2</sub>Si合金で得られたスペクトルは、経過時間の進 行とともにいったん極小値を示し、再び増加するという典型 的な久保-鳥谷部関数に類似した形をしており、ミュオンが 特定の格子サイトに捕獲されていることを示している。なお 経過時間が長くなるとデータのばらつきが大きくなるのは、



図4 溶体化処理したAl-1.6%Mg<sub>2</sub>Si合金を室温で163日間 時効,および70,100,150,200℃で1000分時効した試料を温度領域20~300Kで測定した試料から得られ たスピン緩和スペクトルから計算された捕獲率<sup>5)</sup>



図3 溶体化処理したAl-1.6%Mg<sub>2</sub>Si合金を(a) 40K, (b) 100K, (c) 160K, (d) 300K (室温) で測定したミュオンスピン緩和スペクトルと, (e) 室温で165日時効した試料を300K (室温) で,および (f) 473Kで1000分時効した試料を270Kで測定したミュオンスピン緩和スペクトル

## J. JILM 64 (2014. 8)

測定される陽電子の数が少なくなるためである。図3は溶体 化処理したAl-1.6%Mg<sub>2</sub>Si合金を40,100,160,300K(室温) で測定したミュオンスピン緩和スペクトルと,室温で165日 時効した試料を300K(室温)で,および473Kで1000分時 効した試料を270Kで測定したミュオンスピン緩和スペクト ルを示す。図中の破線は久保-鳥谷部関数で近似した曲線を 示している。測定温度が40Kでは,図2(b)と同様にいった ん極小値を示して,再び増加するという挙動を示したのに対 して,測定温度が上昇して例えば(d)に示した室温では, 極小値は示さなくなった。同様の挙動は,長時間室温保持し た(e)や,473Kで時効した(f)の試料の測定でも得られ ており、ミュオンを捕獲する原子空孔の数,あるいはミュオ ンがトラップされるサイトの影響を受けていると考えられ る。

類似のスピン緩和スペクトルを温度領域20~300Kで測定 し,緩和幅ム,捕獲率v<sub>t</sub>,再拡散率v<sub>d</sub>,初期捕獲率P<sub>o</sub>の4つを パラメータとしたモンテ・カルロ・シミュレーションで観測 スペクトルの解析を行った。図4には捕獲率v<sub>t</sub>の結果を示す。 50Kまでの低温部で捕獲率が高いが,その後減少する。そし て100Kから200Kにかけて増加して300Kに向けて減少して いる。その他の追加実験の結果を踏まえて,このような挙動 は次のような原因によると考えられる。(1) 50K以下の低温 側の高い捕獲率は不純物として含まれるFe等の微量元素や、 Mg原子でのミュオンのトラップが生じ、温度上昇に伴い減 少する。(2) 200KあたりでみられるピークはMg-Si-vacancy クラスタの生成により、ミュオンがトラップされる。(3) 200K以上の温度では、原子空孔数の減少に伴い、捕獲率が 減少する。これらの研究成果は、一部学術論文で公表してい る<sup>4),5)</sup>。今後、他の合金系等との比較実験を実施するととも に、アルミニウム合金中で形成されるMg-Si-vacancyクラス タのような溶質原子クラスタの構造とミュオン緩和スペクト ルの関係について詳細に調べる予定である。

## 参考文献

- K. Matsuda, Y. Sakaguchi, Y. Miyata, Y. Uetani, T. Sato, A. Kamio and S. Ikeno: J. Mater. Sci., 35 (2000), 179–189.
- S. Kim, J. H. Kim, H. Tezuka, E. Kobayashi and T. Sato: Mater. Trans., 54 (2013), 297–303.
- 3) 堂山昌男:日本金属学会会報, 25 (1986), 808.
- S. Wenner, R. Holmestad, K. Matsuda, K. Nishimura, T. Matsuzaki, D. Tomono, F. L. Pratt and C. D. Marioara: Phys. Rev. B 86 (2012), 104201.
- S. Wenner, K. Nishimura, K. Matsuda, T. Matsuzaki, D. Tomono, F. L. Pratt, C. D. Marioara and R. Holmestad: Acta Mater., 61 (2013), 6082–6092.